



УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, П.Ф. 35-54, 11120 Београд, Србија

Тел: +381 11 3248464, Факс: +381 11 3248681

На основу члана 30 Закона о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 103 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“ бр. 162/11 – пречишћен текст, 167/12, 172/13 и 178/14), члана 79 Статута Електротехничког факултета Универзитета у Београду и члана 48 Правилника о докторским студијама Електротехничког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће на седници од 13.12.2016. године, донело је

О Д Л У К У

Именује се Комисија за усмену одбрану и усваја извештај Комисије у саставу: др Предраг Иваниш, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Александра Смиљанић, редовни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Бане Васић, редовни професор, *University of Arizona, Department of ECE*, др Лазар Сарановац, ванредни професор, Електротехнички факултет у Београду, др Горан Ђорђевић, ванредни професор, Електронски факултет у Нишу, о прегледу и оцени урађене докторске дисертације под насловом: **„Декодовање кодова са малом густином провера парности у присуству грешака у логичким колима“** кандидата **Срђана Бркића, мастер инж. електротехнике и рачунарства.**

Извештај се упућује на разматрање Већу научних области техничких наука, које је одлуком под бројем 612-06-5180/2-15 од 23.11.2015. године дало сагласност на предлог теме докторске дисертације.

Објављени научни радови кандидата у часописима међународног значаја:

Часописи међународног значаја (M20):

- [1] S. Brkic, P. Ivanis, and B. Vasic, “Reliability of Memories Built from Unreliable Components under Data-Dependent Gate Failures,” *IEEE Communications Letters*, Vol. 19, Iss. 12, pp. 2098–2101, December 2015 (DOI: 10.1109/LCOMM.2015.2496266, ISSN: 1089-7798, IF=1.268) (M22)
- [2] S. Brkic, O.-Al Rasheed, P. Ivanis, and B. Vasic, “On Fault-Tolerance of the Gallager B Decoder under Data-Dependent Gate Failures,” *IEEE Communications Letters*, Vol. 19, Iss. 8, pp. 1299–1302, Avgust 2015 (DOI: 10.1109/LCOMM.2015.2442981, ISSN: 1089-7798, IF=1.268) (M22)

ДЕКАН

Електротехничког факултета

Проф. др Зоран Јовановић